

Judul:

Metrology

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Metrology.; Microstructure--Measurement.; Microsystems and nanosystems

Nomor Panggil:

e20509569

Penerbitan:

Springer Singapore

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)